

## 優秀賞

安田さんは、テスト手法のひとつである Fault Localization と呼ばれる、バグの位置を推定する技術を取りあげ、その精度を向上させるためのテストセットの作成方法の提案をされました。演習期間中に実施した実験と考察を通して、提案手法の効果とその限界を、丁寧に解明しており、また、同じ目的を持つ既存研究に対する位置づけもきちんと行われています。

この手法を社内へ展開する際のベースとなるだけでなく、今後学術的に深めていくことが可能な研究として、高く評価します。

より多様な評価を踏まえて考察を深めることで、当該分野の主要国際会議での発表レベルに到達できる成果だと思います。

以上を評価して優秀賞を与えることとします。

(トップエスイー代表、本位田真一)